

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации М. С. Кравченко
«Разработка измерительного комплекса на основе метода цифровой
спекл-интерферометрии для прецизионного контроля деформаций
при термовакуумных испытаниях», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
2.2.6 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы»

Диссертационная работа М. С. Кравченко посвящена актуальной теме – разработке оптико-электронного измерительного комплекса для контроля деформаций крупногабаритных элементов космических аппаратов при их испытаниях в условиях, приближенных к космическим. Способность осуществления неразрушающего контроля в широком диапазоне условий, непрерывно в течение длительного времени существенно повышает эффективность измерительной системы и расширяет возможности ее применения. Соответственно, цель и задачи, поставленные в диссертационной работе М. С. Кравченко, являются актуальными и имеют значимость.

Название диссертации полностью соответствует ее теме и ее содержанию. Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, являются обоснованными. Автореферат изложен последовательно и аргументировано. Результаты диссертационной работы опубликованы в ряде статей, в том числе четыре из них в журналах из перечня ВАК. Промежуточные результаты докладывались на нескольких конференциях. Практическая значимость подтверждена актом о внедрении.

Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне и производит положительное впечатление. Считаю, что содержание автореферата диссертации Максима Сергеевича Кравченко соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.6 – Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы.

Сейфи Наталья Андреевна, к.т.н.

Младший научный сотрудник отдела телевидения и тепловидения, Филиал Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники»

630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 2/1
тел. (383) 3309111; e-mail: natalia_nsk@inbox.ru

подпись Н.А. Сейфи удостоверяю,
вед. специалист по персоналу

Е.П.

Отзыв получен 16.02.2016 *А. Венюков М.И.*